

시스템 반도체의 테스트를 위한 소켓 및 보드의 오픈/쇼트 테스트 시스템

대분류 반도체 분류 측정/검사장비 응용분야 시스템 반도체

기술개요

시스템 반도체가 테스트 메인보드에 장착되기 전에 소켓과 프로그램 보드에 대한 오픈/쇼트(Open/Short) 문제점을 사전에 테스트할 수 있는 장치에 관한 기술

기술 경쟁력 및 특징

기존 기술 문제점	본 기술의 특징
<ul style="list-style-type: none"> 엔지니어의 수작업이 필요하며 실수에 의한 문제점이 발생함 	<ul style="list-style-type: none"> 오픈/쇼트 테스트로 인한 프로그램 보드 개발 일정을 단축시킬 수 있고, 번인 시험 전 소켓 검증을 통한 테스트 안정성 확보가 가능
<ul style="list-style-type: none"> 반도체 개발 시 진행되는 신뢰성시험의 소켓 및 보드 공정불량으로 인한 문제점을 사전에 확인하기 힘듦 	<ul style="list-style-type: none"> 재사용으로 인한 고가의 소켓 및 보드 구매 비용 절감 효과가 있으며, 신뢰성 시험 중에 발생할 수 있는 불량을 사전에 방지함으로써 개발기간을 단축할 수 있음



<시스템 반도체 프로그램 보드 오픈/쇼트 테스트 시스템>

적용분야

- 스마트폰
- 자율주행자동차
- 사물인터넷

TRL 단계

1	2	3	4	5	6	7	8	9
기초연구 단계		실험 단계		시작품 단계		실용화 단계		사업화